# Микроструктура и сверхпроводящие свойства керамики DyBaCuO, легированной Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, NaCl и KClO<sub>3</sub>

© Т.С. Орлова, J.Y. Laval\*

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия \* Laboratoire de Physique du Solide, CNRS ESPCI, 75231 Paris, Cedex 05, France

E-mail: orlova.t@mail.ioffe.ru

(Поступила в Редакцию 15 марта 2007 г.)

Изучалось влияние легирования солями Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, NaCl и KClO<sub>3</sub> на микроструктуру и сверхпроводящие характеристики керамик с номинальными составами  $Dy_{1-x}M_xBa_2Cu_{3-y}O_{7-\delta}$  и DyBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-y</sub>O<sub>7-\delta</sub>:  $M_x$  для M = Na, K; x = 0.2, 0.3 и y = 0, 0.2. Характеризация микроструктуры производилась методом просвечивающей электронной микроскопии с локальным энергетически селективным рентгеновским анализом *in situ* (проба ~ 1 nm). Анализ показал, что ни один из легирующих элементов (Na, K или Cl) не входит в 123 зерна в каком-либо значительном количестве и, как результат, критическая температура сверхпроводящего перехода остается практически неизменной в пределах 90–93.5 K. К и Cl сегрегируют в границах зерен. Показано, что зернограничная сегрегация хлора вызывает значительное увеличение плотности сверхпроводящего критического тока (в 3–5 раз при 70 K) по сравнению с нелегированным образцом. Обсуждаются возможные механизмы влияния Cl на межзеренный критический ток.

PACS: 74.81.Bd, 74.25.Fy

## 1. Введение

Использование высокотемпературных сверхпроводников типа R = 123 (R = Y, Dy) для практических целей (в качестве микроволновых резонаторов, магнитов, кабелей) [1] затрудняется главным образом из-за наличия в них большеугловых границ зерен (ГЗ) [2], которые ведут себя как слабые связи. Критический ток  $I_c$  спадает экспоненциально, уже начиная с разориентаций зерен, превышающих  $2-7^{\circ}$ . Чтобы уменьшить негативное влияние границ зерен на  $I_c$ , в последнее время было предпринято много усилий для создания текстуры и улучшения связывания зерен в этих объемных сверхпроводниках [3,4].

Химическое легирование также представляется многообещающим для улучшения транспортных свойств ГЗ. Манхартом с соавторами [5] было получено возрастание почти на порядок плотности критического тока J<sub>c</sub> через 24-градусную [001] симметричную границу наклона при 4.2 К в результате легирования кальцием. Легирование кальцием керамик DyBaCuO было исследовано в [6-8], при этом микроструктура ГЗ и их химический состав исследовались с помощью локального энергетически селективного рентгеновского анализа (EDX energy dispersive X-ray analysis) in situ в просвечивающем электронном микроскопе. Было найдено, что Са сегрегирует в ГЗ с концентрацией, в 1.5-3.5 раза превышающей концентрацию в прилегающих зернах. Ширина обогащенного кальцием слоя вокруг границы не превышала ±5 nm. Было экспериментально показано, что предпочтительное замещение мест Ва в ГЗ не приводит к улучшению их транспортных свойств, в то время как преобладающее замещение мест Dy приводит к значительному возрастанию межзеренного критического тока. Величина плотности критического тока  $J_c$  достигала значений, больших  $10^3 \,\mathrm{A}\cdot\mathrm{cm}^{-2}$ , уже при  $T \approx 0.8T_c \ (T_c -$  критическая температура сверхпроводящего перехода). Для обычных синтезированных керамик такие токи являются очень значительными.

В то же время легирование кальцием приводит и к существенному понижению Т<sub>с</sub>, что создает препятствия для использования материалов, легированных Са, при повышенных температурах ( $\geq 77 \, \text{K}$ ). В настоящее время ведутся исследования по легированию кальцием преимущественно только ГЗ. Определенный успех уже достигнут в [9], где путем диффузии кальций вводился в границу бикристалла, выращенного методом текстурирования из расплава. В тонкопленочных гетероструктурах были созданы специальные промежуточные слои, легированные кальцием, что привело к увеличению суммарного критического тока в этих структурах [10]. С другой стороны, поиск альтернативных легирующих элементов, эффективных для улучшения транспортных свойств ГЗ по-прежнему остается очень актуальным. В [11] высказывается предположение, что Na мог бы стать одним из таких элементов.

Легирование щелочными элементами, такими как Na и K, изучалось ранее в ряде работ [12–19]. Главным образом исследовалось влияние такого легирования на критическую температуру  $T_c$ . Например, в [13] легирование производилось путем номинального замещения бария в YBa<sub>2-x</sub> $M_x$ Cu<sub>3</sub>O<sub>y</sub> ( $0 \le x \le 0.2$ ) (M = K, Na), при этом в качестве легирующих соединений использовались NaNO<sub>3</sub>, NaCl или KNO<sub>3</sub>. Было получено понижение  $T_c$  при легировании NaCl и KNO<sub>3</sub>, в то время как при введении NaNO<sub>3</sub>  $T_c$  оставалась практически неизменной

при тех же концентрациях легирующего элемента. В [12] изучалось легирование натрием в  $Y_{1-x}Na_xBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  ( $0 \le x \le 0.5$ ), т.е. при номинальном замещении иттрия, в качестве легирующего соединения использовался NaNO<sub>3</sub>. Для концентраций натрия  $x \le 0.2 T_c$  практически не изменялась, затем начинала заметно уменьшаться с дальнейшим увеличением x. Однако во всех этих работах исследовалось влияние щелочных элементов главным образом на  $T_c$ , но не на транспортные характеристики, такие как межзеренный критический ток. Кроме того, не проводилось прямого исследования реального содержания легирующих элементов ни в матрице — зернах, ни тем более в ГЗ.

Попытки исследовать магнитооптическим методом влияние легирования калием на межзеренное связывание (grain coupling) в сверхпроводящих керамиках YBCO были предприняты в [17–19]. Было получено небольшое повышение критической температуры (температура начала перехода в сверхпроводящее состояние  $T_c^{\text{onset}} = 105 \,\text{K}$ ). Наблюдалось также улучшение сверхпроводящих характеристик ГЗ, а именно: при приложении внешнего магнитного поля Н типичные джозефсоновские вихри проникали в ГЗ легированных образцов при гораздо более высоких температурах и величинах Н, чем в случае нелегированных образцов. Специальный химический анализ, проведенный в работе [17], показал, что в керамике, легированной КСЮ<sub>3</sub>, присутствуют только следы калия и заметное количество хлора. Однако никакого исследования по распределению легирующих элементов в матрице — зернах и тем более в ГЗ не было проведено.

Таким образом, данные по сегрегации в ГЗ и ее влиянию на поведение межзеренного критического тока в керамиках 123, легированных Na, K или Cl, до сих пор отсутствуют в литературе.

В настоящей работе исследуется влияние легирования солями  $Na_2CO_3$ , NaCl или  $KClO_3$  на микроструктуру керамики DyBaCuO, включая возможную сегрегацию на  $\Gamma 3$ , и на результирующие сверхпроводящие характеристики, главным образом на поведение критического тока.

#### 2. Экспериментальная методика

Исходные и легированные керамики DyBaCuO были изготовлены номинально чистыми и с добавлением легирующего компонента (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, NaCl или KClO<sub>3</sub>) методом классической твердофазной реакции, описанной, например, в [6]. Поскольку при легировании некоторыми элементами, например серебром [20], иногда удавалось достичь лучших результатов для керамик с некоторым дефицитом меди, в качестве исходных составов для Dy:Ba:Cu были выбраны как стехиометрическое соотношение 1:2:3, так и 1:2:2.8. Порошки исходных реактивов Dy<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, BaCO<sub>3</sub>, CuO и легирующего вещества (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, NaCl или KClO<sub>3</sub>) тщательно перемешивались и прессовались в таблетки, которые отжигались три раза при 920°C на воздухе в течение 10 h каждый раз с промежуточным измельчением, перемешиванием и прессованием для полного завершения реакции и достижения хорошей гомогенности конечных материалов. Затем таблетки спекались при 960°C в течение 60 h и окончательно отжигались в потоке кислорода при 480°C в течение 5 h с последующим охлаждением в печи.

В дополнение к нелегированным составам  $DyBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  и  $DyBa_2Cu_{2.8}O_{7-\delta}$  были получены две следующие серии легированных образцов.

В серии *S* концентрация натрия выбиралась равной дефициту Dy или вдвое большей в связи с возможной потерей Na в процессе изготовления керамик из-за его летучести, т.е. легирование осуществлялось по типу номинального замещения. Были приготовлены и исследованы составы  $Dy_{1-x}Na_xBa_2Cu_{3-y}O_{7-\delta}$  и  $Dy_{1-x}Na_{2x}Ba_2Cu_{3-y}O_{7-\delta}$  (для x = 0.2 и y = 0 и 0.2). Поскольку в литературе [15] отмечается различное влияние натрия на  $T_c$  иттриевых керамик при введении его различными путями (добавлением NaNO<sub>3</sub> или NaCl), для ряда составов мы использовали два различных легирующих соединения Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> и NaCl. В дальнейшем образцы, полученные путем введения Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, будем относить к подгруппе *S*1, а керамики, приготовленные с добавлением NaCl, — к подгруппе *S*2 (табл. 1).

Во второй серии образцов (серии A) Na или K добавлялись как избыточные к основным элементам, взятым в соотношении Dy:Ba:Cu (1:2:3 или 1:2:2.8), т.е. легирование осуществлялось по типу добавления к стехиометрическому соотношению основных компонент или к дефицитному по меди. В результате были приготовлены образцы со следующими номинальными составами:

— подгруппа A1 — DyBa<sub>2</sub>Cu<sub>1-y</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>: Na<sub>x</sub> (x = 0.2 и y = 0; 0.2), в которой натрий добавлялся в виде Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> в процессе смешивания исходных ингредиентов;

— подгруппа A2 — DyBa<sub>2</sub>Cu<sub>1-y</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>: Na<sub>x</sub> (x = 0.2, 0.3 и y = 0; 0.2), когда натрий добавлялся в виде NaCl;

— подгруппа A3 — DyBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>: K<sub>x</sub> (x = 0.3), в которой образцы легировались калием путем смешивания окислов основных компонентов с KClO<sub>3</sub>.

Полученные образцы характеризовались порошковой рентгеновской дифрактометрией (XRD), проведенной на автоматическом рентгеновском дифрактометре Philips с  $AgK_{\alpha}$ -излучением. Микроструктурный и композиционный анализы были выполнены на сканирующем растровом электронном микроскопе (SEM) и 200 kV · Jeol 2010 F просвечивающем электронном микроскопе (TEM), оборудованном полевой эмиссионной пушкой и встроенным энергетически селективным рентгеновским анализатором (PGT EDX). Для наблюдений и локального рентгеновского анализа *in situ* в TEM образцы сначала утончались до 25–30 $\mu$ m механической полировкой, а затем Ar<sup>+</sup>-ионной бомбардировкой до достижения прозрачности для прохождения электронов ( $\leq 50$  nm).

**Таблица 1.** Параметры решетки *a*, *b*, *c*, коэффициент орторомбичности  $\eta = 2(b-a)/(a+b)$ , удельное электросопротивление при комнатной температуре  $\rho_{300}$  и основные сверхпроводящие характеристики ( $T_c$  — критическая температура,  $J_c$  — плотность критического тока) для исходных стехиометрического и Си-дефицитного образцов, а также для образцов, полученных путем легирования по типу номинального замещения диспрозия (тип S)

Тип дегирорания	Образен	Параметры решетки			n	тк	$J_c$ , A · cm <sup>-2</sup>	ana Q. cm
тип легирования	Oopased	a,Å	b,Å	$c,  m \AA$	η	$I_c, \mathbf{K}$	$(T = 70 \mathrm{K})$	$p_{300}, \Delta 2$ · cm
Нелегированный образец	$DyBa_2Cu_3O_{7-\delta}$	3.822	3.892	11.676	0.018	91.7	200	$2.0 \cdot 10^{-3}$
То же	$DyBa_2Cu_{2.8}O_{7-\delta}$	3.824	3.896	11.676	0.016	90	140	$6.5 \cdot 10^{-3}$
$S1:Na_2CO_3$	$Dy_{0.8}Na_{0.2}Ba_2Cu_3O_{7-\delta}$	3.824	3.887	11.670	0.016	90	80	$25 \cdot 10^{-3}$
S2:NaCl	$\begin{array}{l} Dy_{0.8}Na_{0.2}Ba_{2}Cu_{2.8}O_{7-\delta}\\ Dy_{0.8}Na_{0.4}Ba_{2}Cu_{2.8}O_{7-\delta} \end{array}$	3.824 3.824	3.896 3.892	11.670 11.676	0.018 0.018	90.7 92.3	120 400	$\begin{array}{c} 3.7 \cdot 10^{-3} \\ 1.2 \cdot 10^{-3} \end{array}$

**Таблица 2.** Параметры решетки *a*, *b*, *c*, коэффициент орторомбичности  $\eta = 2(b - a)/(a + b)$ ,  $\rho_{300}$  и основные сверхпроводящие характеристики ( $T_c$  — критическая температура,  $J_c$  — плотность критического тока) для исходных стехиометрического и Си-дефицитного образцов, а также для образцов, полученных путем легирования по типу добавления (тип A)

Тип легирования	Образец	Параметры решетки			n	тк	$J_c$ , A · cm <sup>-2</sup>	ana Q. cm
		a,Å	b,Å	c,Å	η	$I_c, \mathbf{K}$	$(T = 70 \mathrm{K})$	$p_{300}, s_2 \cdot c_{111}$
Нелегированный образец	DyBa <sub>2</sub> Cu <sub>3</sub> O <sub>7-δ</sub>	3.822	3.892	11.676	0.018	91.7	200	$2.0 \cdot 10^{-3}$
То же	$DyBa_2Cu_{2.8}O_{7-\delta}$	3.824	3.896	11.676	0.016	90	140	$6.5\cdot10^{-3}$
A1:Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	$DyBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ : Na <sub>0.2</sub>	3.824	3.896	11.676	0.018	92	120	$4.0 \cdot 10^{-3}$
	$DyBa_2Cu_{2.8}O_{7-\delta}:Na_{0.2}$	3.826	3.884	11.658	0.015	88.5	80	$8.0\cdot10^{-3}$
A2:NaCl	$DyBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ : Na <sub>0.3</sub>	3.820	3.884	11.664	0.018	93	770	$6.5\cdot10^{-4}$
A3:KClO <sub>3</sub>	$DyBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ : K <sub>0.3</sub>	3.822	3.885	11.664	0.017	93.7	570	$7.0\cdot 10^{-4}$

Сверхпроводящие свойства изучались путем измерения температурных зависимостей удельного электросопротивления  $\rho(T)$  и вольт-амперных (I-V) характеристик четырехконтактным методом. Величина критического тока  $I_c$  определялась по критерию  $1\mu V \cdot mm^{-1}$ .  $I_c$  измерялся при различных температурах в отсутствие и в присутствии внешнего магнитного поля. Магнитное поле  $0 \le H \le 100$  Ое прикладывалось перпендикулярно транспортному току и создавалось двумя медными катушками Гельмгольца.

# 3. Результаты и обсуждение

3.1. Микроструктурная характеризация образцов и *T<sub>c</sub>*. Полный список изученных образцов, нелегированных и легированных по типу *S*, приведены в табл. 1, *a* образцов, легированных по типу *A*, — в табл. 2.

Рентгеновская дифрактометрия показала, что все исследуемые образцы были практически однофазными и соответствовали соединению 1-2-3. EDX-анализ в SEM и TEM показал, что при всех видах легирования Sи A независимо от легирующего вещества (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> или NaCl) практически весь натрий теряется уже в процессе приготовления керамик. Специальный контрольный химический анализ, проведенный на образце с номинальным содержанием натрия x = 0.2, дал значение реального содержания натрия в образце равным  $\sim 0.005$  wt.% (точность измерения составляла  $\pm 5\%$ ).

При легировании обоими хлорсодержащими соединениями (NaCl и KClO<sub>3</sub>) хлор был найден практически во всех исследованных зернах, но в малых количествах, не превышающих 0.1 at.%. Следы калия (< 0.05 at.%) были обнаружены лишь в некоторых 123 зернах. К и Cl также были найдены во вторичных фазах, таких как BaCO<sub>3</sub> и DyBaCu<sub>2</sub>O<sub>z</sub>.

Таким образом, в керамиках, легированных по типу S — номинального замещения диспрозия, Na практически совсем не входил в 123 зерна, т.е. реально дефицит диспрозия не возмещался, что привело к образованию вторых фаз. В таких образцах действительно методами EDX в SEM и TEM было обнаружено некоторое количество вторых фаз, главным образом BaCO<sub>3</sub> и в меньшем количестве CuO.

В керамиках, легированных по типу A — путем добавления легирующего компонента, небольшое количество вторых фаз было найдено лишь для Си-дефицитных соединений. Образцы DyBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>: Na<sub>0.3</sub> и DyBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>: K<sub>0.3</sub> имели однородную структуру с равноосными зернами с малой вариацией по размеру и средним размером  $d \approx 2-3 \mu$ m, в то время как нелегирован-

ная керамика Dy123 имела вытянутые зерна со средней длиной  $L \approx 25 \,\mu\text{m}$  и шириной  $W \approx 12 \,\mu\text{m}$  аналогично подобным керамикам, ранее исследованным в [8].

Вычисленные из дифракционных картин параметры решетки приведены в табл. 1 и 2. Видно, что легирование всех типов не приводит к какому-либо существенному изменению параметров a, b и c. Только в Си-дефицитных образцах параметры b, c и коэффициент орторомбичности  $\eta = 2(b-a)/(a+b)$  слегка уменьшались, что, по-видимому, свидетельствует о чуть меньшей степени окисления  $(7-\delta)$  по сравнению с остальными керамиками. Соответственно критическая температура для этих составов была немного ниже (табл. 1 и 2). Для всех остальных образцов значения Т<sub>с</sub> находились в пределах 90-93.5 К, т.е. легирование практически не изменяло ее по сравнению с Т<sub>с</sub> для нелегированного образца DyBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub>, поскольку легирующие элементы либо совсем не входят в решетку 123 (Na), либо входят в незначительном количестве (К и Cl).

3.2. Поведение критического тока и структура границ. Рис. 1 демонстрирует температурную зависимость плотности критического тока для исходных образцов и легированных по типу замещения (S), в то время как на рис. 2 приведены подобные зависимости для образцов, легированных по типу добавления (A). Видно, что для легирования Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> вне зависимости от типа легирования  $(S \, или A)$  никакого увеличения критического тока не было получено; наоборот, он даже уменьшался. Локальный EDX-анализ с очень малой пробой (около 1 nm) непосредственно в TEM не обнаружил какой-либо заметной сегрегации Na в ГЗ.



**Рис. 1.** Температурные зависимости плотности критического тока для нелегированных образцов  $DyBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  (*1*) и  $DyBa_2Cu_{2.8}O_{7-\delta}$  (*2*);  $Dy_{1-x}Na_xCu_{2.8}O_{3-\delta}$  (*x* = 0), легированного  $Na_2CO_3$  (*3*), и  $Dy_{1-x}Na_{2x}Cu_{2.8}O_{3-\delta}$  (*x* = 0.2), легированного NaCl (*4*).



**Рис. 2.** Температурные зависимости плотности кристического тока для исходного  $DyBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  (*1*) и образцов с номинальным составом  $DyBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ :  $Na_x$ , легированных путем добавления  $Na_2CO_3$  (x = 0.2) (*2*) и NaCl (x = 0.3) (*3*), а также образцов с номинальным составом  $DyBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ :  $K_x$ , легированных KClO<sub>3</sub> (x = 0.3) (*4*).

Очевидно, уменьшение тока связано с тем, что из-за присутствия вторых фаз в этом типе образцов сверх-проводящий объем уменьшается, а состояние границ не улучшается. Об ухудшении транспортных свойств таких образцов свидетельствует и увеличение в них удельного электросопротивления  $\rho_{300}$  при комнатной температуре (табл. 1 и 2).

В то же время легирование обоими хлорсодержащими соединениями (NaCl и KClO<sub>3</sub>) приводит к явному увеличению плотности критического тока, особенно в образцах с типом легирования *A*. Например, в образцах DyBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>:Na<sub>0.3</sub> и DyBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>:K<sub>0.3</sub> плотность критического тока при 70 K в 3–4 раза превышала *J<sub>c</sub>* в нелегированных образцах DyBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> (табл. 2). Даже в образце *S*2, несмотря на наличие вторых фаз, критический ток возрос вдвое в результате легирования NaCl (табл. 1).

Таким образом, в образцах, легированных натрием путем введения  $Na_2CO_3$ , не произошло увеличения межзеренного критического тока для обоих способов легирования (*S* и *A*), в то время как в случае легирования NaCl или KClO<sub>3</sub>  $J_c$  значительно возрастал. Это позволяет сделать заключение, что увеличение критического тока связано с введением хлора.

Микроскопическое исследование ГЗ совместно с EDXанализом *in situ* показало, что Cl сегрегирует во всех типах границ: так называемых грязных (содержащих включения вторичных фаз размером  $\geq 2$  nm); границах, покрытых тонкой (< 2 nm) пленкой вторичных фаз, и



**Рис. 3.** Концентрационные профили для К (1) и Cl (2) поперек чистой границы между двумя зернами основной 123 фазы.



**Рис. 4.** Зависимость плотности критического тока  $J_c$  от величины приложенного магнитного поля H для образцов DyBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> (1), DyBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>: Na<sub>0.3</sub> (2) и DyBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>: K<sub>0.3</sub> (3).

в чистых (свободных от вторичных фаз). Принципы классификации ГЗ в сверхпроводящих керамиках приводятся более подробно в [20]. Отмечается присутствие относительно большого количества ГЗ, покрытых тонкой пленкой вторичных фаз с содержанием хлора до 0.3 at.%. Следует отметить, что главным образом чистые границы участвуют в создании перколяционных путей для критического тока [20]. Хлор сегрегировал в таких границах с концентрацией 0.3–0.9 at.%. Ширина сегрегационного профиля (обогащенный хлором слой вокруг границы) варьировалась в больших пределах от  $\pm 5$  до  $\pm 15$  nm для различных границ. Калий тоже сегрегировал в отдельных чистых границах, но с меньшей концентрацией, не превышающей 0.3 at.%. На рис. 3 показан пример сегрегационных профилей Cl и K на одной из чистых границ. По-видимому, наличие K в ГЗ не имеет принципиального значения, поскольку при легировании NaCl получен даже больший эффект увеличинея  $J_c$ , чем в случае KClO<sub>3</sub>.

Рис. 4 демонстрирует поведение  $J_c$  в слабых магнитных полях для керамик, легированных NaCl или KClO<sub>3</sub>, в сравнении с нелегированным образцом DyBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>. Видно, что легирование хлором, хотя и увеличивает  $J_c$ при H = 0, но не приводит к стабилизации критического тока в слабых магнитных полях, как это наблюдается для Ca-легированных керамик [6,7].

Быстрое снижение  $J_c$  уже в малых магнитных полях свидетельствует о поведении зернограничной сетки преимущественно как слабосвязанной, т. е. ГЗ являются слабыми связями в перколяционном пути критического тока. Аналогично [6,20,21] определяющий тип слабых связей в зернограничной сетке высокотемпературных сверхпроводящих поликристаллов можно оценить из температурных зависимостей критического тока при приближении к  $T_c$ . Согласно [22,23], указанные зависимости описываются уравнением

$$I_c = \operatorname{const}(1 - T/T_c) \tag{1}$$

для связей типа SIS (сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник), а для SNS-связей (сверхпроводник-нормальный металл-сверхпроводник) — уравнением

$$I_c = \operatorname{const}(1 - T/T_c)^2.$$
<sup>(2)</sup>

На рис. 5 демонстрируются зависимости Іс вблизи  $T_c$  от величины  $(1 - T/T_c)$  для различных керамик. Результаты представлены в двойном логарифмическом масштабе для определения показателя степени  $\alpha$  в уравнении  $I_c = \text{const}(1 - T/T_c)^{\alpha}$ . Там же штриховыми линиями показаны прямые, соответствующие значениям  $\alpha = 1$  и 2. Из рисунка видно, что в случае легирования  $Na_2CO_3$  вне зависимости от типа легирования (S или A) при приближении к Т<sub>с</sub> экспериментальные точки ложатся на прямые, соответствующие значениям  $\alpha$ , близким к 1. В случае же легирования хлорсодержащими соединениями (NaCl или KClO<sub>3</sub>) при обоих типах легирования  $(S \ u \ A)$  через экспериментальные точки вблизи  $T_c$  могут быть проведены прямые со значением а, более близким к 2. Это означает, что легирование диспрозиевой керамики обоими хлорсодержащими компонентами независимо от номинального химического соединения приводит к изменению определяющего поведения зернограничной сетки от SIS к SNS, в то время как легирование Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> не изменяет характер связей в ГЗ по сравнению с исходной нелегированной керамикой.



Рис. 5. Температурные зависимости критического  $DyBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  (1); образцов, легированных тока для Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>: DyBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>: Na<sub>0.2</sub> (2) и Dy<sub>0.8</sub>Na<sub>0.2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> (3); образцов, легированных NaCl:  $Dy_{0.8}Na_{0.4}Cu_{2.8}O_{7-\delta}$ (4)  $DyBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ : Na<sub>0.3</sub> (5),также образцов а  $DyBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ : K<sub>0,3</sub>, легированных KClO<sub>3</sub> (6). Штриховые линии соответствуют  $\alpha = 1$  и 2 (см. текст).

Таким образом, при сравнении результатов легирования путем введения Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> и хлорсодержащих NaCl и KClO<sub>3</sub> однозначно показана определяющая роль хлора в улучшении транспортных свойств ГЗ.

Различные механизмы увеличения зернограничного тока в результате легирования ГЗ обсуждаются в работах [9,10,24, 25]. Среди таких механизмов рассматривается компенсация дефицита носителей заряда [24,25], который существует вокруг ГЗ. Согласно [24], образование таких зарядодефицитных областей вокруг ГЗ обусловлено наличием оборванных и ослабленных связей в ГЗ. С другой стороны, авторы [10] предлагают модель, согласно которой такие области существуют, чтобы скомпенсировать избыточный положительный заряд, который, по их мнению, всегда присутствует в ядре границы из-за существующих в ней дилатационных напряжений. Легирование ионом с меньшей положительной валентностью, например Ca<sup>2+</sup>, на места Y<sup>3+</sup> (или Dy<sup>3+</sup>) приводит к формированию сверхдопированного состояния (overdoping state), что будет компенсировать дефицит носителей заряда (дырок) вблизи ГЗ, увеличивая таким образом критический ток через границу. Действительно, в [6-8] было экспериментально показано, что замещение кальцием преимущественно мест Dy в ГЗ приводит к очень значительному увеличению плотности межзеренного критического тока, в то время как предпочтительное замещение кальцием мест Ва не дает увеличения Ј<sub>с</sub>. Однако в нашем случае Na не сегрегировал в ГЗ, а К — только в малом количестве в отдельных границах, тогда как сегрегация хлора действительно вызывала значительное

увеличение  $J_c$ . Ион С<sup>-</sup> имеет отрицательный заряд, и, по-видимому, может занимать главным образом места кислорода. Согласно [26], имеется дефицит кислорода в ГЗ из-за деформации атомных связей в ядре границы. Поскольку ионный радиус Cl<sup>-</sup> (1.81 Å) значительно превышает радиус  $O^{2-}$  (1.4 Å), присутствие  $Cl^{-}$  может существенно уменьшить дилатационные напряжения в ядре ГЗ, приводя тем самым к уменьшению компенсационных дырочных-дефицитных областей вокруг ГЗ, ответственных за подавление критического тока, протекающего через границу. Как результат значение J<sub>c</sub> вырастет. Уменьшением дырочно-дефицитных областей вокруг ГЗ можно объяснить и изменение типа определяющих слабых связей в зернограничной сетке с SIS на SNS. Следует отметить, что, хотя замещение  $Dy^{3+}$ ионами с меньшей валентностью (Са<sup>2+</sup>), так называемый эффект валентности, приводит к более значительному увеличению межзеренного критического тока [6-8], а также к стабилизации его в малых магнитных полях, размерный эффект (различие в размерах легирующего и замещающего ионов) в случае легирования хлором тоже, по-видимому, может быть достаточно эффективным в улучшении транспортных свойств ГЗ. Кроме того, в отличие от легирования Са легирование хлором не ухудшает Т<sub>с</sub>.

На основании проведенных в работе исследований можно сделать следующие выводы.

1) При обоих типах легирования Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, NaCl и KClO<sub>3</sub> керамических образцов DyBaCuO (номинальном замещении Dy и добавлении легирующих веществ к стехиометрическому соотношению основных компонентов) было обнаружено, что Na не входит в 123 зерна и только незначительные следы K и Cl были зафиксированы в 123 матрице, чем и объясняется слабое изменение  $T_c$  (в пределах 90–93.5 K) для исследованных образцов.

2) Впервые была обнаружена и измерена сегрегация К и Сl в ГЗ. Показано, что наибольший эффект оказывает сегрегация хлора. Она приводит к изменению поведения зернограничной сетки от SIS- к SNS-типу и значительному увеличению плотности критического тока (в 3–5 раз при 70 K). Наиболее вероятной причиной такого увеличения  $J_c$  является уменьшение дилатационных напряжений в ГЗ и связанного с ними дефицита носителей заряда в областях вокруг ГЗ.

Авторы выражают благодарность M. Sennour за помощь в структурной характеризации образцов методом растровой электронной микроскопии, а также K. Goretta за проведение химического анализа содержания натрия.

### Список литературы

- Proc. of the 4th European Conf. of Applied Inst. Phys. Conf. Ser. N 167 (2000).
- [2] D.C. Larbalestier. Science 274, 736 (1996).

- [3] M. Murakami. In: Melt processed high temperature superconductors / Ed. M. Murakami. World Scientific, Singapore (1993).
- [4] R. Flükiger, G. Grasso, J.-C. Grivel, F. Marti, M. Dhalle, Y. Huang. Supercond. Sci. Technol. 10, A 68 (1997).
- [5] J. Mannhart, H. Bielefeldt, B. Goetz, H. Hilgenkamp, A. Schmehl, C.W. Schneider, R.R. Schulz. Physica C 341–348, 1393 (2000).
- [6] J.Y. Laval, T.S. Orlova. Supercond. Sci. Technol. 15, 1244 (2002).
- [7] J.Y. Laval, T.S. Orlova. Supercond. Sci. Technol. 16, 1139 (2003).
- [8] T.S. Orlova, J.Y. Laval, Yu.P. Stepanov. Supercond. Sci. Technol. 17, 51 (2005).
- [9] Y. Zhao, C.H. Cheong. Physica C 386, 286 (2003).
- [10] I.A. Ovid'ko. Mater. Sci. Eng. A 313, 207 (2001).
- [11] D. Seron, D.E. Oates, A.C. Anderson, G. Hammerl, J. Mannhart, P.J. Hirst, R.G. Humphreys, M. Hein. Supercond. Sci. Technol. 17, S 423 (2004).
- [12] Y. Dalichaouch, M.S. Torikachvili, E.A. Early, B.W. Lee, S.L. Seaman, K.N. Yang, H. Zhou, M.B. Maple. Solid State Commun. 65, 1001 (1988).
- [13] X.S. Wu, F.Z. Wang, S. Nie, J.S. Liu, L. Yang, S.S. Jiang. Physica C 339, 129 (2000).
- [14] T.P. Beales, J.S. Thorp, A.S. Al-Hawery. J. Mater. Sci. 11, 192 (1992).
- [15] M. Ausloos, Ch. Laurent, H.W. Vanderschueren, A. Rulmont, P. Tarte. Solid State Commun. 68, 539 (1988).
- [16] A. Fartash, H. Oeterreicher. Solid State Commun. 66, 39 (1988).
- [17] A. Veneva, I. Iordanov, L. Toshev, A. Stoyanova-Ivanova, D. Gogova. Physica C 308, 175 (1998).
- [18] A. Koblischka-Veneva, M.R. Koblischka, M. Murakami. Physica C **357-360**, 201 (2001).
- [19] A. Koblischka-Veneva, M.R. Koblischka, P. Simon, F. Mücklish, M. Murakami. Physica C 382, 311 (2002).
- [20] T.S. Orlova, J.Y. Laval, A. Dubon, C. Nguyen-Van-Huong, B.I. Smirnov, Yu.P. Stepanov. Supercond. Sci. Technol. 14, 467 (1998).
- [21] J. Jung, I. Isaah, M.A.-K. Mohamed. Phys. Rev. B 48, 7526 (1993).
- [22] V. Ambegaokar, A. Baratoff. Phys. Rev. Lett. 10, 486 (1963).
- [23] P.G. DeGennes. Rev. Mod. Phys. 36, 225 (1964).
- [24] A. Schmehl, B. Goetz, R.R. Schulz, C.W. Schneider, H. Bielefeldt, H. Hilgenkamp, J. Mannhart. Europhys. Lett. 47, 110 (1999).
- [25] H. Hilgenkamp, C.W. Schneider, R.R. Schulz, B. Goetz, A. Schmehl, H. Bielefeldt, J. Mannhart. Physica C 326–327, 7 (1999).
- [26] R.F. Klie, J.P. Buban, M. Varela, A. Franceschetti, C. Jooss, Y. Zhu, N.D. Browning, S.T. Pantelides, S.J. Pennycook. Nature 435, 475 (2005).